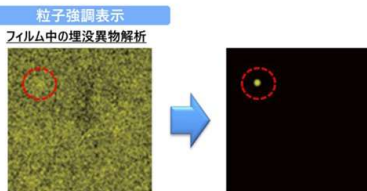


名称	顕微鏡型蛍光エックス線分析装置	メーカー	堀場製作所	型式	XGT-9000	取得	R2
概要	試料にX線を照射することによって発生する特性X線を検出、解析した結果、試料を構成する元素および組成情報が得られます。試料の組成比(wt.%)を標準試料を用いない半定量法で算出します。 光学CCDによる計測部分のイメージ画像と計測結果を重ね合わせたマッピング表示ができます。						
応用事例	- ステンレスの種類 - 製品に混入していた物質(無機物質)が、どのような物質(例えば骨やガラスなど)なのか。 - 電気回路やコネクタ部品等組立品での元素分布状態による短絡箇所などの表示・解析(マッピング)						
主な仕様	測定可能試料: 固体(最大試料サイズ: 100(x) × 100(Y) × 150mm(Z))、液体、ゲル状、粉体試料 測定元素範囲: ナトリウム(Na)～ウラン(U)、プローブサイズ: 100 μ m						
測定時間	(前処理時間+400[秒])/件(個) [通常分析時]						ピーク分離による異物・不良解析が可能 粒子強調表示 フィルム中の埋没異物解析  複数画像掛け合わせ LEDパターンの不良解析 
出力形態	画面に表示、印刷物、PDF						
試料等の制約	次の場合は、ご相談ください。 - 試料の大きさが1mm未満の場合 - 試料の一部分を測定する場合 - 粉体試料の計測を行う場合 - 試料の高さが20mmを超える場合(試料台自体での高さも調整が必要です) その他、お気軽にご相談ください。						
使用料 手数料	機器貸出: 1時間まで 4,950円 2時間目以降 3,250円 / 時間 依頼試験: 7,650円/件						
お問い合わせ 工業総合研究所 技術支援部 TEL: 017-728-0900, FAX: 017-728-0903 e-mail: kou_souken@aomori-itc.or.jp ○本設備は公益財団法人JKA 設備拡充補助事業により導入されました。							

ピーク分離による異物・不良解析が可能

